

О1

© 1992

КРИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЫСШИХ МОМЕНТОВ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКОВ  
В ПЕРКОЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

А.Е. М о р о з о в с к и й, А.А. С н а р с к и й

Первые моменты токов или джоулевой диссипации в неоднородных средах описывают основные свойства таких сред в целом. Так, например, первый момент джоулевой диссипации определяет эффективную проводимость  $\sigma_e$  [1], а второй –  $1/f$  шум в таких средах [2, 3]. Момент  $n$ -го порядка можно записать в виде

$$\mathcal{C}^e(n, d) = \frac{\langle \mathcal{C}(n, r) (\vec{E} \cdot \vec{j})^n \rangle}{(\langle \vec{E} \rangle \langle \vec{j} \rangle)^n}, \quad (1)$$

где  $d$  – мерность задачи,  $\langle \dots \rangle$  – усреднение по объему,  $\vec{E}$  – напряженность электрического поля,  $\vec{j}$  – плотность тока, предполагается что локально имеет место закон Ома  $\vec{j} = \sigma(\vec{r}) \vec{E}$ ;  $\mathcal{C}(n, \vec{r})$  – локальный момент.

В специальном случае  $n=1$   $\mathcal{C}(1, \vec{r})=1$  и  $\mathcal{C}^e(1, d)=1$  и из [1], согласно  $\langle E_j \rangle = \langle E \rangle \langle j \rangle = \sigma_e \langle E \rangle^2$ , следует выражение для  $\sigma_e$ . Для  $n=2$   $\mathcal{C}(2, \vec{r}) = \{\delta\sigma \delta\sigma\}/\sigma^2$ , – фурье-компоненты квадратичной флуктуации проводимости, а  $\mathcal{C}^e(2, d)$  – относительная спектральная плотность  $1/f$  шума всей среды. Чем больше неоднородность, тем выше уровень  $1/f$  шума [2, 3, 4].

Для определения критического поведения  $\mathcal{C}^e(n, d)$  необходимо знать распределение полей и токов, что в случайно неоднородных средах возможно только при использовании либо модели такой среды, либо при проведении численного эксперимента. И если при вычислении  $\sigma_e$  в первом приближении можно ограничиться нулевым по  $h$  приближением ( $h = \sigma_2/\sigma_1 \ll 1$ ,  $\sigma_2$  – проводимость плохо,  $\sigma_1$  – хорошо проводящих фаз), основная закономерность поведения  $\sigma_e$  при этом сохраняется [5], то такое приближение уже для  $n=2$  не применимо. В [6, 7] было указано, что выше порога протекания, когда ток течет в основном по хорошо проводящей фазе, при вычислении  $1/f$  шума учет плохо проводящей может привести к изменению критического индекса – кроссоверу. В [7, 8] на основании модели слабого звена МСЗ, учитывающей одновременное протекание тока по обеим фазам, получены критические индексы  $1/f$  шума выше, ниже и на пороге протекания и определены условия кроссовера. В [9] численными методами проверена зависимость  $\mathcal{C}^e(2, d=2, 3)$  от  $h$  на пороге протекания. В [11, 12] рассмотрено скейлингование моментов, и при помощи численных методов под-

твржден кроссовер выше порога протекания в двумерном слое.

В настоящем сообщении найдены аналитические выражения для критических индексов и подтверждена скейлинговая гипотеза для  $n$ -х моментов.

Выше порога протекания простейший вариант МСЗ с  $h \neq 0$  представляет собой параллельное соединение мостика хорошо проводящей фазы ( $\sigma_1$ ) и тонкой прослойки плохо проводящей ( $\sigma_2$ ), геометрия которых удовлетворяет соотношениями (2) (основное положение МСЗ)

$$l \sim \alpha_0 |\tau|^{-t+\nu(d-2)}, \quad s \sim \alpha_0^{d-1} |\tau|^{-q-\nu(d-2)}, \quad (2)$$

где  $l$  - длина мостика диаметром  $\alpha_0$ ,  $s$  - площадь прослойки, толщиной  $\alpha_0$ ,  $\alpha_0$  - минимальный размер структуры,  $t, q, \nu$  - критические индексы проводимости и корреляционной длины,  $\rho$  - концентрация хорошо проводящей фазы,  $\rho_c$  - порог протекания,  $\tau = (\rho - \rho_c)/\rho_c$ .

Ниже порога протекания ( $\tau < 0$ ) прослойка и мостик соединены последовательно.

Вычисляя, согласно МСЗ и токи (подробности для  $n=2$  смотри в [7, 8]) в мостике и прослойке, падением напряжения на остальных элементах структуры, при учете только первых с  $h$  слагаемых можно пренебречь, получаем с учетом (2).

$$\begin{aligned} C^e(n, d) &\sim C_1(n, d) \tau^{-k_n} + C_2(n, d) h^n \tau^{-w_n}, \quad \tau > 0, \\ C^e(n, d) &\sim C_2(n, d) |\tau|^{-k'_n} + C_1(n, d) h^n |\tau|^{-w'_n}, \quad \tau < 0, \end{aligned} \quad (3)$$

где критические индексы следующим образом выражаются через индексы,  $t, q$  и  $\nu$

$$\begin{aligned} k_n &= [2\nu(d-1)-t](n-1), \quad w_n = k'_n + n(t+q), \\ k'_n &= (2\nu-q)(n-1), \quad w'_n = k_n + n(t+q). \end{aligned} \quad (4)$$

Как и для  $n=2$ , при определенном наборе параметров возможна такая ситуация, когда слагаемые с  $h$  в (3) будут доминировать, т. е. произойдет смена критического поведения - поведение с критическим индексом  $k_n$  или  $k'_n$  сменится поведением с  $w_n$  ( $w'_n$ ).

Учет первых ненулевых по  $h$  слагаемых позволяет установить поведение  $C^e(n, d)$  на пороге протекания, т. е. при  $\tau \sim \Delta$ , где  $\Delta \sim h^{1/(t+q)}$  - область размежки

$$\begin{aligned} C^e(n, d) &\sim C_1(n, d) h^{-s_n} + C_2(n, d) h^{-z_n}, \\ \text{где } s_n &= k_n(t+q)^{-1}, \quad z_n = k'_n(t+q)^{-1}. \end{aligned} \quad (5)$$

Подставляя в (6) численные значения критических индексов  $t, q$  и  $\nu$  для разных  $d$  легко убедиться, что  $s_n > 0$  и  $z_n > 0$ , тем

|              | $n = 1$ | $n = 2$    | $n = 3$   |           |
|--------------|---------|------------|-----------|-----------|
| $-\dot{x}_n$ | $d = 2$ | 1.3(1.3)   | 1.3(1.1)  | 1.3(1.02) |
|              | $d = 3$ | 0.9 (1.12) | 0.9(1.1)  | 0.9(1.03) |
| $-\dot{y}_n$ | $d = 2$ | 1.3(1.3)   | 4(4)      | 6.6(6.9)  |
|              | $d = 3$ | 1.9(1.75)  | 5.7(5.62) | 9.5(9.3)  |

самым (5) подтверждает качественные соображения о том, что с увеличением неоднородности среды – ростом  $h^t C(n, d)$  – растет. Отметим так же, что для всех  $d$ , кроме  $d=2$ ,  $S_n - Z_n \approx 0.3(n-1)$ .

Что же касается двумерного случая, то, как показано в [1] на пороге протекания средние значения  $n$ -х степеней диссилирующих энергий в обеих фазах одинаковы, следовательно, слагаемые в (5) могут отличаться только за счет отличия  $C_1(n, d)$  и  $C_2(n, d)$ . Действительно, из (6) получаем для  $d=2$   $S_n - Z_n = (2\nu - t) \times n(n-1)/(t+q) \approx (n-1)/2$ .

Сравним теперь значения  $k_n$  и  $k'_n$  (4) с численными значениями, полученными в [10]. Введенные в 10 критические индексы  $x_n$  и  $y_n$  связаны с  $k_n$  и  $k'_n$ , а тем самым согласно (4) и с  $t$ ,  $q$  и  $\nu$  следующим способом

$$\dot{x}_n = (d-2)\nu - t, \quad \dot{y}_n = -(2n-1)[(d-2)\nu + q]. \quad (7)$$

Выберем значения  $t$ ,  $q$  и  $\nu$  для двумерного случая  $t=q \approx \nu = 4/3$  и для трехмерного  $t \approx 1.8$ ,  $q \approx 0.98$ ,  $\nu \approx 0.9$ . В таблице приведены значения  $-\dot{x}_n$  и  $-\dot{y}_n$  согласно (7), а в скобках даны значения из [10], полученные числовым экспериментом. Сравнение значений показывает, что, несмотря на простоту МСЗ, согласие является удовлетворительным. Приведем, наконец,  $x_n$  и  $y_n$  для критической размерности  $d_c = 6$ , для которой  $t$ ,  $q$  и  $\nu$  известны точно:  $t=3$ ,  $\nu=0.5$ ,  $q=0$ :  $x_n=-1$ ,  $y_n=-4(2n-1)$ .

В заключение заметим, что учет следующих поправок по малости  $h$  в  $C^e(n, d)$  приводит к более сложным выражениям, нежели для случая  $C^e(n=1)$  [5]

$$C_e \approx \sigma, \tau^t (A_0 + A_1 h \tau^{-(t+q)} + \dots), \quad \tau > 0, \quad (8)$$

где  $A_0$ ,  $A_1, \dots$  – константы не зависящие от  $h$  и  $\tau$ . Эффективная проводимость удовлетворяет гипотезе подобия и может быть выражена через скейлинговую функцию  $\varphi: C^e(\tau, h) = \sigma, h^s \varphi(\tau, h^m)$ , где  $s=t/(t+q)$ ,  $m=1/(t+q)$  [5]. Как показывают подробные расчеты по МСЗ в  $C^e(n>1, d)$ , в ряде, аналогичном (8), существует не только степенной ряд по параметру  $h \tau^{-(t+q)}$ , но и ряд по параметру  $(h \tau^{-(t+q)})^n$ , что приводит к более сложному скейлингованию. Данный вопрос заслуживает отдельного рассмотрения.

Мы благодарим *A. Kolek*, предоставившего нам возможность ознакомиться с его работами до публикации и обсуждение затронутых вопросов, и *A.-M.S. Tremblay* за присылку оттисков его работ.

### Список литературы

- [1] Дыхне А.М. // ЖЭТФ. 1970. Т. 59. В. 7. С. 110-115.
- [2] Rammal R. // J. de Phys. Lett. 1985. V. 46. N 4. L. 129-136.
- [3] Rammal R., Tannous C., Tremblay A.-M.S. // Phys. Rev. A. 1985. V. 31. N 4. P. 2662-2671.
- [4] Коган Ш.М. // УФН. 1985. Т. 145. В. 2. С. 285-328.
- [5] Efros A.L., Shklovskii B.I. // Phys. Stat. Sol. (b). 1976. V. 76. N 2. h. 475-488.
- [6] Tremblay A.-M.S., Fourcade B., Breton P. // Physica A. 1989. V. 157. N 2. P. 89-100.
- [7] Морозовский А.Е., Снарский А.А. // Письма ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 2. С. 51-54.
- [8] Морозовский А.Е., Снарский А.А. // ЖЭТФ. 1989. Т. 95. В. 5. С. 1844-1849.
- [9] Бездунов И.В., Кучеров С.А., Снарский А.А. Тез. докл. II Всес. конф. „Вычислительная физика и математическое моделирование”. Волгоград, 1989. М. 1990. С. 9-11.
- [10] Tremblay R.R., Albinet G., Tremblay A.-M.S. // Phys. Rev. B. 1991. V. 43. N 13. P. 11546-11549.
- [11] Kolek A. // Phys. Rev. B. 1991 (to be published)
- [12] Kolek A. (private communication).
- [13] Морозовский А.Е., Снарский А.А. // Письма в ЖЭТФ. 1990. Т. 52. В. 4. С. 871-872.

Поступило в Редакцию  
28 января 1992 г.